

1st WORKSHOP on ELECTRONIC DEVICE AUTOMATIC TESTING

16 November, 2026, University of Milan-Bicocca

Aula Sironi – Piazza della Scienza - U3 Building - Milan

Chairmen: D. Appello (Technoprobe), A. Baschirotto (U. Milan-Bicocca)

PROGRAM

- 08.00** Registration
- 09.00** Opening (**C. Riccardi** – Direttore Dip. di Fisica)
- 09.15** **C. Musca** (ANIE) "Bridging Innovation and Technological Sovereignty: The Strategic Role of Automatic Testing from Research to Market"
- 09.35** **F. Cavenaghi, M. Zegaoui**, "AI-Assisted Feasibility Analysis of Probe Cards for WBG Device Testing"
- 09.55** **A. Shah** (U. Milan-Bicocca), "Modeling ATE Test-Hardware for Pre-Silicon Validation in a SystemC-AMS Virtual Testing Framework"
- 10.15** **C. Bertani** (STMicroelectronics), "Finding the Sweet Spot: Test & Stress Optimization for complex automotive MCUs"
- 10.35** **D. Turossi** (Infineon), "Challenges and solutions for High Voltage/Current ATE testing of Gate Drivers"
- 11.00** Coffee break
- 11.20** **R. Massolini** (Marvell), "Production testing challenges at 400Gbit/s and beyond"
- 11.40** **G. Iaria** (PoliTorino), "TestYard: Open-Source Benchmarks from Chipyard framework for VLSI hardware testing"
- 12.00** **G. Lastella** (Inventm), "From Silicon Validation to Mass Production: a unified Testing Strategy"
- 12.40** Lunch break
- 14.00** **E. Giusti** (Cosmic), "Rethinking Semiconductor Testing: A UX-Based Test Operating System Powered by AI"
- 14.20** **A.I. Melloni** (PoliMilano), "Tools and techniques for photonic testing"
- 14.40** **A. Ressa** (Synopsys) "Automating validation in high-speed Serdes"
- 15.00** Panel
- 16.00** – Conclusions

All the presentations will be given in Italian

1st WORKSHOP on ELECTRONIC DEVICE AUTOMATIC TESTING

16 November,, 2026, University of Milan-Bicocca
Aula Sironi – Piazza della Scienza - U3 Building - Milan

La Lombardia e l'Italia costituiscono un polo strategico di rilevanza internazionale nella progettazione e nello sviluppo dei circuiti integrati. In questo panorama di eccellenza, il **Testing Automatico** rappresenta un passaggio cruciale e imprescindibile per assicurare standard elevati di qualità, affidabilità e sostenibilità nella produzione delle tecnologie elettroniche di nuova generazione.

Per rispondere con efficacia alle dinamiche di un settore in rapida evoluzione, l'**Università di Milano-Bicocca** e **Technoprobe** sono liete di presentare la prima edizione del **Workshop sul Testing Automatico di Circuiti Integrati**, mirato a promuovere una maggiore strutturazione del settore per stimolare l'innovazione e facilitare il trasferimento tecnologico.

Trattandosi di un'**iniziativa a carattere nazionale**, il Workshop nasce con l'obiettivo primario di **creare un network italiano coordinato tra gli esperti del settore**. Questa rete integrata permetterà fin da subito una maggiore efficienza operativa, ponendo al contempo le basi per presentarsi in modo più forte, coeso e strutturato all'interno del panorama internazionale.

Nel corso della giornata, i partecipanti avranno modo di:

- **Incontrare alcuni tra i principali protagonisti italiani** del settore della ricerca e dell'industria;
- **Presentare le attività e i progetti in corso**, condividendo metodologie avanzate e tecnologie all'avanguardia;
- **Favorire interazioni e collaborazioni strategiche** per avvantaggiare i singoli attori e dare nuovo impulso e competitività all'intero comparto.

L'evento si inserisce nel quadro strategico delineato dalla recente costituzione dell'**ATLab (Automatic Testing Laboratory)** presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca. L'ATLab nasce con la missione di fungere da ponte solido tra formazione, ricerca e mondo del lavoro attraverso tre pilastri fondamentali:

- **Ricerca scientifica**, con lo sviluppo di progetti di ricerca innovativi;
- **Formazione specialistica**, mediante corsi dedicati e tesi di laurea e di dottorato di ricerca;
- **Disseminazione**, con la promozione di eventi pubblici e momenti di confronto come questo WS.

In tale prospettiva di crescita, a partire dall'Anno Accademico 2027/28 l'Ateneo integrerà all'interno di un insegnamento universitario un modulo incentrato sul **Testing Automatico**, avviando la preparazione di figure professionali qualificate e rispondenti alle esigenze del mercato.

L'obiettivo è rendere il Workshop un appuntamento annuale di riferimento per la comunità italiana, sperando di coinvolgere nuovi partner e realtà del settore nella sua organizzazione. Questa sinergia amplierà la portata dell'evento e porrà le basi per iniziative di respiro internazionale negli anni a venire.

In questa prospettiva, gli organizzatori sono già attivi per candidare questa stessa sede ad ospitare nel uno dei più importante eventi del settore a livello europeo: un traguardo ambizioso per il quale sarà indispensabile il pieno sostegno e la collaborazione attiva di tutta la comunità italiana, coesa e sinergica. Sarà un'opportunità straordinaria che fungerà da vetrina per l'eccellenza italiana, fondamentale per proiettare il nostro settore verso nuovi prestigiosi traguardi.

L'evento è aperto a ricercatori, professionisti del settore, aziende ed esperti interessati al futuro del Testing Automatico. La registrazione è gratuita ma obbligatoria al sito

https://www.mbtechnoservices.com/ATLab_WS26/ATLab_WS26.html

Per i dottorandi partecipanti sarà possibile sostenere un esame finale per l'eventuale acquisizione dei CFU